

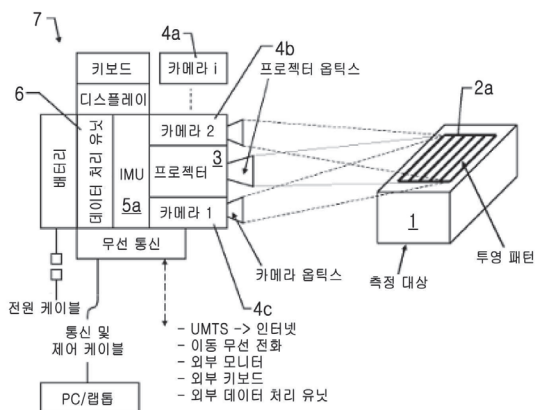
▪ 자료제공 : 특허법인 대아

측정 대상 표면에 대한 3D 좌표들을 결정하기 위한
광학 측정 방법 및 측정 시스템
(Optical measurement method and measurement system for
determining 3D coordinates on a measurement object surface)

출원번호(일자) : 10-2013-7000016 (2013.01.02)
공개번호(일자) : 10-2013-0032351 (2013.04.01)
국제공개번호(일자) : WO 2011/160962(2011.12.29)
출원인 : 라이카 게오시스템스 아게

요약

본 발명은 측정 대상 표면(1s)의 다수의 측정 지점들에 대한 3D 좌표들을 결정하기 위한 광학 측정 방법에 관한 것이다. 이러한 목적을 위해, 측정 대상 표면(1s)은 프로젝터(3)를 이용하여 다양한 패턴들(2a, 2b)의 패턴 시퀀스로 조사되고, 패턴 시퀀스로 조사되는 측정 대상 표면(1s)의 이미지 시퀀스는 카메라 시스템(4)으로 기록되고, 측정 지점들의 3D 좌표들은 이미지 시퀀스의 평가에 의해 결정된다. 본 발명에 따르면, 이미지 시퀀스가 기록되는 동안, 적어도 이미지 시퀀스의 개개의 이미지들의 조사 시간들 동안, 프로젝터(3), 카메라 시스템(4) 및/또는 상기 측정 대상(1)의 병진 및/또는 회전 가속도들은 각각의 경우에, 이미지 시퀀스의 각각의 개개의 이미지들의 조사 시간들 중, 가속도들에 대한 복수의 값들, 특히 다수의 값들이 획득된다. 따라서, 측정된 가속도들에 기초하여, 3D 좌표들을 결정할 때, 프로젝터(3), 카메라 시스템(4) 및/또는 측정 대상(1)의 움직임들을 알고리즘적으로 고려하는 것이 가능하고, 움직임들은 이미지 시퀀스의 각각의 개개의 이미지들의 조사 시간들 동안 일어나고 이미지 시퀀스의 각각의 개개의 이미지들에서 불안정함 및/또는 모션 블러를 초래한다.

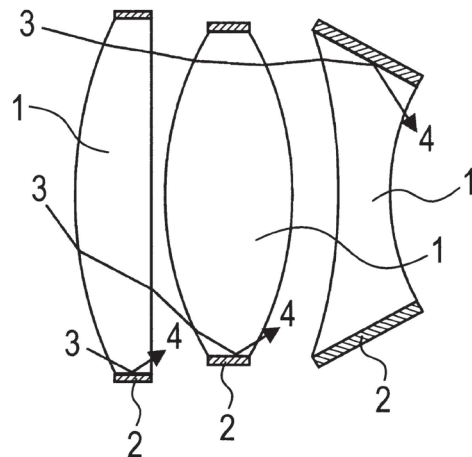


광학 소자용 내부 반사방지 흑색 코팅 물질
(INTERNAL ANTIREFLECTION BLACKENING COATING
MATERIA FOR OPTICAL DEVICES)

출원번호(일자) : 10-2012-0116226 (2012.10.18)
공개번호(일자) : 10-2013-0043586 (2013.04.30)
출원인 : 캐논 가세이 가부시끼가이샤

요약

본 발명은 환경상의 큰 부담을 주는 코울타르도 메틸렌 디아닐린도 갖지 않고, 코팅 물질의 우수한 경시 저장 안정성을 가지며, 코팅 물질로 코팅된 광학 소자를 고온 다습한 환경에 장시간 저장할 경우에도 낮은 내부 반사율을 유지할 수 있는 광학 소자용 내부 반사방지 흑색 코팅 물질에 관한 것이다. 본 발명의 코팅 물질은 코팅 물질 고형분에 대하여 카본 블랙 0.1-20.0 질량%, 및 이산화티타늄, 산화제이철 및 사산화삼철, 옥시수산화철 및 지르코니아로부터 선택된 금속 산화물 20-70 질량%를 함유하고, 총 코팅 물질에 대하여 활성 수소기 또는 전자 흡인성 기를 갖는 실란 커플링제를 0.5-10.0 질량%로 함유하며, 상기 코팅 물질은 활성 수소 화합물과 전자 흡인성 화합물을 함유하고, 50-800 nm의 분산 입자 직경 D90을 갖는다.

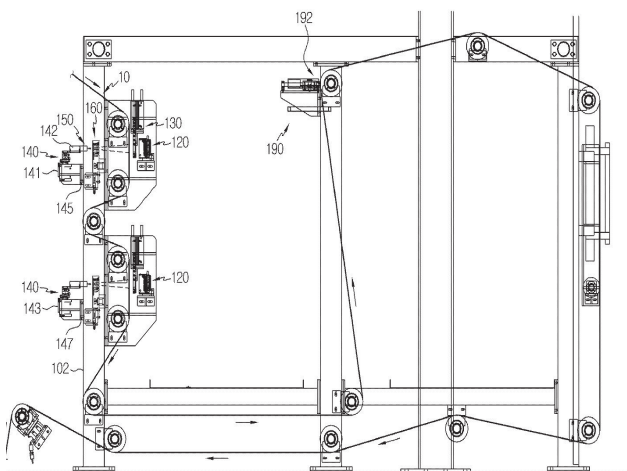


광학 필름의 결함 검사 장치
(Apparatus for inspecting faulty of optical film)

출원번호(일자) : 10-2012-0003610 (2012.01.11)
 공개번호(일자) : 10-2013-0043546 (2013.04.30)
 출원인 : 주식회사 엘지화학

요약

본 발명은 광학 필름의 결함 검사 장치에 관한 것으로서, 광학 필름의 일면에는 보호 부재가 부착되어 있고; 광학 필름에 광을 조사할 수 있는 조명 유니트; 광학 필름과 조명 유니트 사이에 배치된 제1 필터 유니트; 광학 필름을 촬영할 수 있도록 조명 유니트와 대향되게 설치된 촬영 유니트; 광학 필름과 촬영 유니트 사이에 배치되고 적어도 하나 또는 그 이상의 필터들을 포함하는 제2 필터 유니트; 및 광학 필름과 제2 필터 유니트 사이에 회전 가능하게 설치된 제3 필터 유니트를 구비한다.



광학 네트워크용 반사 반도체 증폭기
(REFLECTIVE SEMICONDUCTOR OPTICAL AMPLIFIER
FOR OPTICAL NETWORKS)

출원번호(일자) : 10-2012-7033993 (2012.12.27)
 공개번호(일자) : 10-2013-0041835 (2013.04.25)
 국제공개번호(일자) WO 2012/000804 (2012.01.05)
 출원인 : 알까펠 루스트

요약

본 명세서는 PON(passive optical networks)에 관한 것이다. 특히, 제한적인 것은 아니지만, GPON(Gigabit PON) 또는 WDM-PON에서의 신호들을 증폭하기 위한 RSOA(reflective semiconductor optical amplifier)의 이용에 관한 것이다. 광학 네트워크에서 상이한 파장들에서의 광을 증폭하도록 구성된 장치(21)가 기술된다. 장치(21)는 제1 파장(25)에서의 광을 증폭하도록 구성된 제1 활성 재료(22) 및 제2 파장(26)에서의 광을 증폭하도록 구성된 제2 활성 재료(23)를 포함한다. 더욱이, 장치(21)는 제1 및 제2 활성 재료들(22, 23)을 분리하고, 제1 파장(25)에서의 광을 반사하도록 구성되며, 제2 파장(26)에서의 광에 실질적으로 투명하도록 구성되는 제1 반사기(24)를 포함한다. 또한, 장치는 제1 반사기(24) 반대편에서, 제2 활성 재료(23)에 인접하며, 제2 파장(26)에서의 광을 반사하도록 구성되는 제2 반사기(27)를 포함한다.

